Нелокальные эффекты при диффузионном распространении тепловых импульсов в системах с центрами захвата неравновесных фононов

© Е.И. Саламатов

Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии наук, 426000 Ижевск, Россия

E-mail: salam@oft.fti.udmurtia.su

(Поступила в Редакцию 26 июня 2001 г. В окончательной редакции 30 августа 2001 г.)

Теоретически изучен процесс распространения тепловых импульсов в системах с дефектами, являющимися центрами захвата неравновесных фононов. К таким дефектам относятся точечные дефекты, на которых реализуются двухуровневые системы (ДУС) различной природы. Показано, что при определенном соотношении между временами релаксации в подсистемах фононов и ДУС наряду с основным сигналом на болометре может появиться дополнительный сигнал, обусловленный переизлучением энергии неравновесных ДУС. Исследуются температурная и концентрационная зависимости времени прихода сигналов на болометр. Результаты теоретических исследований сравниваются с экспериментальными данными по распространению слабонеравновесных тепловых фононов в твердых растворах редкоземельных иттрий-алюминиевых гранатах $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$.

Работа поддержана Российским фондом фундаметальных исследований № (грант № 00-02-17426).

Распространение слабонеравновесных фононов (СНФ), инжектируемых "теплым" генератором $S/T \ll 1$ (S — превышение температуры генератора над температурой термостата T), является одним из основных методов изучения структуры систем, в которых реализуется сильное рассеяние фононов на дефектах (смешанных кристаллов, аморфных материалов и керамик [1-4]). Несмотря на то что в настоящее время существует много теоретических работ по распространению СНФ в реальных материалах (см., например, [5-8]), проблема не может считаться решенной, в частности не до конца понятны механизмы аномального замедления слабонеравновесных фононов (до двух порядков) в твердых растворах редкоземельных иттрийалюминиевых гранатов $Y_{3-x}R_xAl_5O_{12}$ (R = Er, Ho, Tb).

Трудности при теоретическом изучении этого явления обусловлены тем, что распространение короткого теплового импульса является существенно нестационарным процессом, что при наличии в системе низкоэнергетических двухуровневых систем (ДУС) может приводить к ее пространственной неоднородности, связанной с зависимостью состояния ДУС от координаты. Известно, что нестационарный режим обмена энергии с термостатом в системе, состоящей из подсистем с различными временами релаксации, может существенно отличаться от стационарного случая. Так, в работе [9] показано, что процесс охлаждения электронно-дырочной плазмы в полупроводниках в динамическом режиме (после импульсного разогрева плазмы) описывается двумя характерными временами релаксации, значительно отличающимися друг от друга ($\tau_1 \ll \tau_2$). Первое характеризует остывание плазмы и нагрев оптических фононов до выравнивания их эффективных температур, а второе медленное остывание всей системы. Далее будет показано, что аналогичные процессы могут наблюдаться и при распространении короткого теплового импульса в диэлектриках, содержащих достаточную концентрацию ДУС, что и определяет аномальную зависимость времени распространения фононов в таких системах.

1. Основные уравнения

При описании процессов распространения теплового импульса будем исходить из следующих кинетических уравнений, формально совпадающих с уравнениями, использованными в работе [9]:

$$\frac{\partial n_q}{\partial t} + (\Gamma_{tq} + \Gamma_L)n_q = \Gamma_L n_{q0} + \Gamma_{tq} n_{q0}, \tag{1}$$

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \left(\frac{1}{2\pi}\right)^3 \int \omega_q \Gamma_{tq} (n_q - n_{t0}) d^3 q. \tag{2}$$

Здесь n_{q0} , n_{t0} — равновесные числа заполнения фононов при температуре термостата и эффективной температуре ДУС соответственно, E — энергия ДУС, Γ_{tq} — скорость рассеяния фононов на ДУС, Γ_{L} — скорость обмена энергии фононов с термостатом. В линейном приближении по отклонению температуры подсистем S_{q} , S_{t} от температуры термостата T (S_{i} = T_{i} — T) систему уравнений (1), (2) можно преобразовать к следующему виду:

$$\frac{\partial S_q}{\partial t} + (N\Gamma + \Gamma_L)S_q = N\Gamma S_{ti},\tag{3}$$

$$\frac{\partial S_t}{\partial t} = \Gamma \frac{c_{\rm ph}}{c_{\rm tls}} (S_q - S_t), \tag{4}$$

где $c_{\rm ph}{=}4\pi^4(T/T_{\rm D})^3/5$ и $c_{\rm tls}=(\Delta/T)^2\exp(-\Delta/T)/(1+\exp(-\Delta/T))^2$ — теплоемкости фононов и ДУС соот-

936 *Е.И. Саламатов*

ветственно, N — концентрация, Δ — параметр ДУС, $T_{\rm D}$ — температура Дебая. При получении выражений (3), (4) авторы пренебрегли зависимостью Γ_{tq} от q и ограничились линейным по концентрации дефектов N приближении, полагая, что $\Gamma_{tq} = N\Gamma$, где Γ — скорость рассеяния фононов в расчете на один дефект.

2. Пространственно-однородный случай

Прежде чем перейти к рассмотрению пространственно-неоднородной задачи, рассмотрим более простой случай. Пусть в пространственно-однородной системе в начальный момент времени вся избыточная энергия содержится в подсистеме ДУС $S_t(0)=S(0),\,S_q(0)=0.$ Такая ситуация может быть реализована экспериментально при накачке энергии в подсистему парамагнитных уровней путем короткого импульса СВЧ [10]. С помощью преобразования Лапласа по временной переменной для эффективной температуры подсистемы ДУС нетрудно получить

$$S_q(t) = S(0) \left(A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} \right),$$
 (5)

где обратные времена релаксации $-p_1$, $-p_2$ являются решениями квадратного уравнения

$$p^{2} + p[N(1 + c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls}) + \Gamma_{L}] + c_{\rm ph}\Gamma\Gamma_{L}/c_{\rm tls} = 0,$$
 (6)

а коэффициенты A_1 , A_2 имеют вид

$$A_1 = 1 - A_2 = \frac{(p_1 + \Gamma_L + \Gamma c_{ph}/c_{tls})}{(p_1 - p_2)}.$$

Удобно проанализировать решение (6) в том случае, когда одно из слагаемых в квадратных скобках много больше (меньше) другого. В этом случае

$$-p_1 = 1/\tau_1 = \Gamma N(1 + c_{ph}/Nc_{tls}) + \Gamma_L,$$

$$-p_2 = 1/ au_2 = rac{c_{
m ph}}{c_{
m tls}} rac{\Gamma \Gamma_L}{(\Gamma N (1+c_{
m ph}/N c_{
m tls}) + \Gamma_L)}.$$

При быстром теплообмене между фононами и термостатом, $\Gamma_L \gg \Gamma N (1+c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls})$, узкого фононного горла не возникает, и в используемом приближении скорость релаксации ДУС не зависит от их концентрации

$$1/\tau_1 = \Gamma_L$$
, $1/\tau_2 = \Gamma c_{\rm ph}/c_{\rm tls}$.

При наличии узкого фононного горла, $\Gamma_L \ll \Gamma N (1+c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls})$, времена релаксации становятся зависимыми от концентрации дефектов

$$1/\tau_1 = \Gamma N(1 + c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls}) = \frac{c_{\rm ph}}{c_{\rm tls}} \frac{\Gamma}{C},$$
 (7)

$$1/\tau_2 = \frac{c_{\rm ph}}{c_{\rm tls}} \frac{\Gamma_L}{N(1 + c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls})} = \Gamma_L C, \tag{8}$$

где $C = c_{ph}/(Nc_{tls} + c_{ph}) < 1$.

Время τ_1 определяет быстрый процесс выравнивания температур подсистемы ДУС и фононов, который определяется сечением рассеяния фононов на ДУС. После выравнивания температур начинается медленная релаксация всей системы с характерным временем τ_2 . Этот процесс контролируется взаимодействием фононов с термостатом и в использованном при записи выражения (8) пределе не зависит от Γ , а определяется только скоростью обмена энергии фононов с термостатом. Как правило, в экспериментах выполняется условие $c_{\rm ph}/Nc_{\rm tls}\ll 1$, и выражение (8) совпадает с известным выражением Альтшулера [11].

Если характерное время обмена энергии фононов с термостатом определяется только временем диффузионного распространения фононов по объему образца с характерным линейным размером L, то для времени релаксации τ_2 нетрудно получить

$$1/\tau_2 = AL^2/(DC),$$
 (8a)

где D — коэффициент диффузии фононов, A — численный коэффициент порядка единицы, зависящий от геометрии образца. В этом случае условие реализации режима узкого фононного горла можно записать в виде $L^2 > L_0^2 = D au_1/A$.

Далее будет показано, что параметры, описывающие процесс релаксации энергии подсистемы ДУС и фононов в режиме узкого фононного горла в пространственнооднородном случае, являются важными параметрами и при описании распространения тепловых импульсов в таких системах.

3. Распространение теплового импульса

Рассмотрим задачу распространения δ -образного теплового импульса из начала координат в бесконечный одномерный образец. В этом случае в качестве Γ_L в уравнении (1) надо взять диффузионный член, т.е. положить $\Gamma_L = -D_0 \partial^2/\partial z^2$, где D_0 — коэффициент диффузии фононов, определяемый только упругим рассеянием фононов на дефектах. (Здесь мы пренебрегаем теплообменом образца с термостатом). Пространственный Фурье-образ функции $S_q(t,k)$ будет формально совпадать с выражением (5)

$$S_q(t, k) = S(0) \left(A_1(k)e^{-k^2D_1(k)t} + A_2(k)e^{-k^2D_2(k)t} \right).$$

Здесь S(0) — мощность теплового испульса, $D_i(k) = -p_i(k)/k^2$ — эффективные коэффициенты диффузии фононов, $p_i(k)$ определяются из квадратного уравнения, аналогичного (6),

$$A_1 = 1 - A_2 = (p_1 + D_0 k^2 + \Gamma c_{\rm ph}/c_{\rm tls})/(p_1 - p_2).$$
 (9)

В безразмерных переменных k'=kL, $D_i'(k)=D_i(k)/D_0$, $t'=t/t_0$, где L — координата точки измерения температуры (длина образца), $t_0=L^2/2D_0$ — характерное время распространения фононов, вычислен-

ное при учете только упругого рассеяния фононов на дефектах. Для эффективных коэффициентов диффузии имеем

$$D'_{1,2}k^2 = \left(k_0^2 + k'^2 + \sqrt{\left(k_0^2 + k'^2\right)^2 - 4k'^2k_0^2C}\right) / 2. \tag{10}$$

Входящие в это выражение параметры $C=c_{\rm ph}/(c_{\rm ph}+Nc_{\rm tls})<1$ и $k_0^2=(L/L_0)^2$ для одномерного случая (A=1) были введены в конце предыдущего раздела. Из выражений (9),~(10) следует, что при $k'\gg k_0~D_1'=1,~A_1=1,~a$ при $k'\ll k_0~D_2'=C,~A_2=C.$

Пространственная дисперсия коэффициентов диффузии $D_i(k')$ представлена на рис. 1, из которого становится понятен физический смысл введенных параметров. Если $k_0\gg 1$, в системе реализуется режим узкого фононного горла, и время прихода сигнала на болометр определяется медленными процессами: $t_2=L^2/(2D_0C)$ согласно выражению (8a). В случае $k_0\ll 1$ (в отсутствии фононного горла) фононная система не успевает среагировать на изменения в подсистеме ДУС, и время распространения сигнала не зависит от состояния ДУС, $t_1=t_0=L^2/(2D_0)$.

При промежуточных значениях k_0 удобно записать выражение для него в другом эквивалентном виде: $k_0 = \sqrt{2t_0/\tau_1}$. Из этого выражения следует, что k_0 возрастает с ростом числа фононов, успевших неупруго провзаимодействовать с ДУС, для которых реализуется режим узкого фононного горла. Остальные фононы не испытывают неупруго рассеяния на ДУС и их распространение определяется в основном коэффициентом D_0 . Результаты численных расчетов $S_q(t')$ в точке L для различных значений k_0 и C представлены на рис. 2. Из представленных на рисунке зависимостей следует, что амплитуда и положение первого максимума в основном

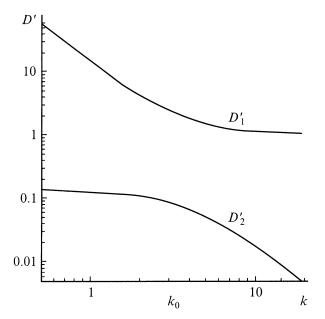


Рис. 1. Пространственная дисперсия эффективных коэффициентов диффузии.

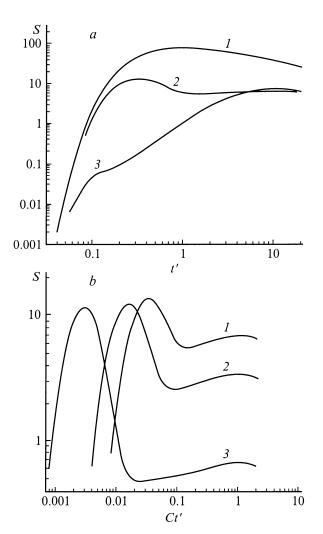


Рис. 2. a — форма сигнала фононной неравновесности в зависимости от параметра k_0 при C=0.1: $k_0=0.0$ (I), 3.0 (2), 10.0 (3); b — форма сигнала в зависимости от параметра C при $k_0=3$. C=0.1 (I), 0.05 (2), 0.01 (3).

определяется параметром k_0 , в то время как форма и положение второго — параметром C.

При приближенном описании зависимости положения и формы максимумов от параметров задачи ограничимся пределом $C \ll 1$. В этом случае

$$A_1(k) = 1 - A_2(k) \simeq 1 - C, \quad k < k_0,$$

 $A_1(k) = 1 - A_2(k) \simeq 1, \quad k > k_0$

и можно получить приближенные выражения, описывающие положение и форму пиков. Для первого пика получаем

$$S_1(t) \simeq e^{-k_0^2 t/t_0} e^{-L^2/4D_0 t} \sqrt{\frac{\pi}{4D_0 t}},$$

из которого для времени прихода его максимума на болометр имеем

$$t_1 = \frac{\sqrt{4k_0^2 + 1} - 1}{2k_0^2} t_0. \tag{11}$$

938 *Е.И. Саламатов*

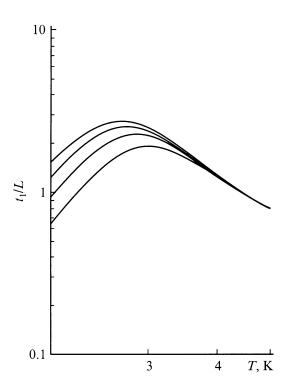


Рис. 3. Нормированное на длину образца время прихода первого максимума для различных $L=4,\,6,\,8,\,10\,\mathrm{mm}$ (снизу вверх).

Приближенное выражение для описания положения и формы второго можно записать только для достаточно больших значений k_0

$$S_2(t) \simeq C \sqrt{\frac{\pi}{4D_0Ct}} e^{-L^2/4D_0Ct}, \qquad t_2 = t_0/C.$$
 (12)

(Заметим, что в рассматриваемом пределе реализуется режим узкого фононного горла и время распространения сигнала не зависит от τ_1).

Перейдем к рассмотрению температурной и концентрационной зависимости процесса распространения теплового импульса. К сожалению, авторам не известны эксперименты по исследованию спин-решеточной релаксации в этих системах в режиме узкого фононного горла и далее будем считать k_0 подгоночным параметром модели, полагая для определенности, что температурная зависимость скорости релаксации $\Gamma(T)$ в (7) является экспоненциальной [11], $\Gamma(T) = \Gamma_0 \exp(-\Delta/T)$ (далее будет показано, что при такой температурной зависимости теоретические результаты вполне удовлетворительно описывают экспериментальные данные). Если считать, что D_0 определяется релеевским рассеянием на дефектах ($D_0 \sim 1/NT^4$), получаем, что k_0 растет как с ростом температуры, так и концентрации дефектов, $k_0 \sim NLT^2\Gamma^{1/2}$. При выполнении условия $k_0 \ge 1$ из выражения (11) следует, что t_1 не зависит от концентрации и растет линейно по параметру L, т.е. ведет себя как сигнал от баллистических фононов, но убывает с ростом температуры. Поскольку при малых k_0 $t_1 \sim T^4$, зависимость $t_1(T)$ имеет максимумом, положение которого определяется температурной зависимостью $\Gamma(T)$. На рис. 3 представлены зависимости $t_1(T)/L$, рассчитанные по формуле (11) при различных значениях параметра L и фиксированных значениях N и Γ_0 , поведение которых качественно совпадает с известными нам экспериментальными данными [4]. Специальные экспериментальные исследования температурной и концентрационной зависимости t_1 при различных L не проводились, но в работе [10] отмечалось, что первый пик ведет себя подобно баллистическому сигналу.

При анализе температурной и концентрационной зависимости времени прихода второго пика ограничимся случаем, когда $k_0\gg 1$, который всегда можно реализовать, рассматривая достаточно длинный образец. При этом вкладом в сигнал на болометре от первого пика можно пренебречь. Для времени прихода максимума второго сигнала имеем

$$t_2(T,N) \sim rac{L^2}{2D_0(T,N)C(T,N)}.$$

На рис. 4 показана температурная зависимость t_2/N при $D_0 \sim 1/NT^4$ и различных концентрациях дефектов. Из рисунка следует, что при достаточно большой концентрации дефектов, когда в области температур вблизи $\Delta Nc_{\rm tls} \gg c_{\rm ph}$, зависимость $t_2(T)$ не является монотонной. При $T < 0.5\Delta$ она экспоненциально растет, а при $T > 0.5\Delta$, когда $c_{\rm tls} \sim 1/T^2$, становится убывающей, $t_2 \sim 1/T$. В остальных областях температуры, для которых $Nc_{\rm tls} \ll c_{\rm ph}$, и для малых концентраций дефектов зависимость $t_2(T)$ имеет обычный характер,

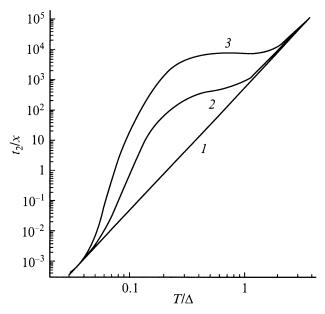


Рис. 4. Время прихода второго максимума, нормированного на концентрацию, при $\Delta/T=0.01$ и различных значениях x: x=0 (1), 0.05 (2), 0.5 (3).

 $t_2(T) \sim T^4$. Что касается концентрационной зависимости t_2 , то в области температур, где $c_{
m tls} \gg c_{
m ph},$ $t_2(N) \sim N^2$.

Проведенный анализ показывает, что предложенная модель качественно описывает температурную и концентрационную зависимость формы сигнала фононной неравновесности, экспериментально наблюдаемую в иттрий-алюминиевых гранатах $Y_{3-x}R_xAl_5O_{12}$ (R=Er, Ho, Tb).

4. Сравнение с экспериментом

Кинетика фононов твердых растворах В $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$ экспериментально исследована достаточно полно. Обнаружено, что при x > 0.2 наблюдается появление второго максимума в сигнале фононной неравновесности и значительное замедление процесса распространения фононов, причем температурная зависимость времени прихода максимума второго сигнала на болометр сложным образом зависит от концентрации примесных атомов эрбия и длины образца. При небольшом содержании примесных атомов (0.2 < x < 0.6) $t_2(T)$ очень быстро (может быть, экспоненциально [10]) возрастает с ростом температуры, а при больших значениях х температурная зависимость $t_2(T)$ характеризуется отрицательной производной. При промежуточных значениях концентрации х знак производной $t_2(T)$ определяется главным образом размерами образца.

Из результатов предыдущих разделов нетрудно понять, что такое поведение $t_2(T)$ в зависимости от концентрации в рамках предлагаемой модели может быть объяснено только при наличии в системе двух подсистем ДУС с отличными друг от друга энергетическими параметрами $\Delta_1 < T < \Delta_2$. Хотя решение задачи с двумя подсистемами ДУС принципиально не отличается от рассмотренного в предыдущих разделах, но приводит к некоторым качественно новым результатам (в частности, появлению третьего максимума на кривой сигнала фононной неравновесности, наблюдаемого в эксперименте [4]) и требует отдельного рассмотрения. Поэтому в данной работе ограничимся пределом больших значений параметра k_0 (точнее, его аналога). В этом случае нетрудно получить физически понятный результат, что время прихода второго максимума определяется параметром $C = c_{\rm ph}/(c_{\rm ph} + N_1 c_{\rm tls,1} + N_2 c_{\rm tls,2}),$ где N_i и $c_{\text{tls},i}$ — концентрация и теплоемкость ДУС i-й подсистемы соответственно.

Из экспериментов по измерению низкотемпературной теплоемкости известно, что в системе $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$ существует дважды вырожденный парамагнитный уровень с $\Delta_2=38.9\,\mathrm{K}$ [12]. Из рис. 4 следует, что именно эти ДУС могут приводить к очень быстрому росту t_2 с температурой. На существование в этой системе низкоэнергетических парамагнитных уровней с $\Delta_1\simeq 4\,\mathrm{K}$ указывают эксперименты по спин-решеточной релаксации [10]. При температурах эксперимента $c_{\mathrm{tls},1}\gg c_{\mathrm{tls},2}$,

и для того чтобы вклад от второй подсистемы ДУС преобладал, концентрация высокоэнергетических ДУС при $x \leq 0.6$ должна быть много больше концентрации низкоэнергетических ($N_2 \gg N_1$). Это возможно в том случае, если низкоэнергетический уровень связан не с каждым примесным атомом, а с некоторой атомной конфигурацией. При малых концентрациях примеси вероятность образования таких конфигураций мала, т.е. $N_1 \ll N_2$. Видимо, именно такая ситуация наблюдается при малых концентрациях примесей в системе $Y_{3-x} Er_x Al_5 O_{12}$, поэтому далее (кроме оговоренного случая) будем пренебрегать вкладом от низкоэнергетических ДУС, ограничиваясь рассмотрением малых концентраций ($x \leq 0.6$).

Для решения задачи требуется определить коэффициент диффузии D_0 и параметры C и k_0 . Коэффициент диффузии D_0 для системы с ДУС нельзя определить непосредственно из эксперимента, поэтому считалось, что в отсутствие ДУС он приблизительно равен последнему для системы $Y_{3-x} Lu_x Al_5 O_{12}$ $D_0 = (3.4/T)^4 (0.2 + x_0)/(x + x_0) \, \mathrm{mm}^2/\mu \mathrm{s}$, где $x_0 = 0.025$ — остаточная концентрация примесей [4]. Температура Дебая твердого раствора для расчета параметра C определялась по формуле $T_D = T_{DY} (M_Y/M_s)^{1/2}$, где $T_{DY} = 750 \, \mathrm{K}$, M_Y — температура Дебая и молярная масса иттриевого граната, M_s — молярная масса твердого раствора [12,13]. Для определения k_0 было использовано приближенное выражение (11). Из сравнения рассчитанной по формуле (11) температур-

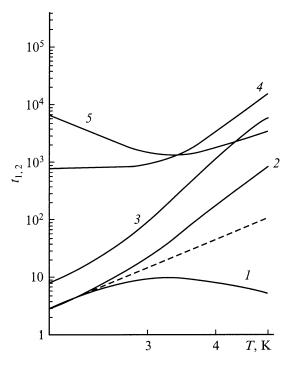


Рис. 5. Температурная зависимость времени прихода (μ s) первого (I) и второго максимума (x=0.2 (2), 0.6 (3); 1.0 (4, 5)) в системе $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$. Штриховая кривая — время прихода максимума в системе без ДУС при x=0.2.

940 *Е.И. Саламатов*

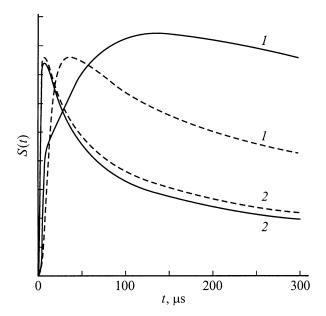


Рис. 6. Сигнал фононной неравновесности в системах $Y_{2.8}$ Er_{0.2}Al₅O₁₂ (сплошные линии) и $Y_{2.8}$ Lu_{0.2}Al₅O₁₂ (штриховые линии) (L=6.8 mm, T=3.35 (I), 2.7 K (2)).

ной зависимости времени прихода первого максимума с экспериментальной (рис. 1 из [4]) было найдено, что $\Gamma_0=6.78\cdot 10^{-5}\,\mu\mathrm{s}^{-1}$ на формульную единицу дефектов. Рассчитанные с этими значениями параметров зависимости $t_{1,2}(T)$ для образцов длиной 6.8 mm и концентрацией примеси 0.2 и 0.6 формульных единиц представлены на рис. 5 (кривые I-3). На рис. 6 представлены сигналы фононной неравновесности, соответствующие образцам $Y_{3-x}\mathrm{Er}_x\mathrm{Al}_5\mathrm{O}_{12}$ (сплошные линии) и $Y_{3-x}\mathrm{Lu}_x\mathrm{Al}_5\mathrm{O}_{12}$ (штриховые линии) при двух температурах T=3.85 и 2.7 К. Результаты теоретических расчетов, представленные на рис. 5 (кривые I-3) и 6, вполне удовлетворительно согласуются с экспериментальными зависимостями (рис. 1, 3 из [4]).

Кривые 4 и 5 на рис. 5 имеют качественный характер и демонстрируют смену наклона зависимости $t_2(T)$ при появлении в системе достаточного количества низко-энергетических ДУС с $\Delta_1 < T$. Расчеты проводились для x=1.0 и $N_1=0.1$ N_2 при различной температурной зависимости коэффициента диффузии $D_0(T)$. При расчете кривой 4 полагалось, что коэффициент диффузии D_0 , как и прежде, определяется релеевским рассеянием фононов на дефектах. Из выражения (12) следует, что в этом случае показатель степени α в зависимости $t_2(T) \sim T^{\alpha}$ не может принимать значения меньше -1, а в экспериментах наблюдается более сильная зависимость $t_2(T)$ с отрицательной производной [4].

Можно предположить, что при достаточно больших концентрациях примесных атомов в системе $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$ затравочный коэффициент диффузии фононов D_0 определяется главным образом рассеянием фононов на межфазных границах. В самом деле, твердые растворы $Y_{3-x}Er_xAl_5O_{12}$ склонны к фазовому

расслоению, что приводит к образованию областей с характерными размерами $20{\text -}100\,\mathrm{nm}$, обедненных и обогащенных примесными атомами [14]. Известно, что при распространении фононов в системах с сильно развитыми границами разделов температурная зависимость коэффициента диффузии фононов уже не определяется релеевским рассеянием, а сложным образом зависит от структуры границ (см., например, [15]). Для иллюстрации такой ситуации при расчете кривой 5 на рис. 5 было положено $D_0(T) = \mathrm{const}$, что позволило получить зависимость $t_2(T)$, качественно совпадающую с экспериментальной (рис. 1 [4]).

Следует отметить, что причиной сильной температурной зависимости $t_2(T)$ с отрицательной производной, наблюдаемой в экспериментах, может являться спектральный состав распространяющихся фононов, не учтенный при нашем упрощенном рассмотрении. В частности, при больших временах распространения сигнала фононной неравновесности значительную роль могут играть распадные процессы [16]. Заметим, что в рамках рассматриваемой в работе модели максимальная задержка сигнала фононной неравновесности будет наблюдаться в системе $Y_{3-x}Tb_xAl_5O_{12}$, для которой известная величина энергетического параметра ДУС, связанного с каждым атомом примеси, составляет $2.45\,\mathrm{cm}^{-1}$ [17]. Для этой системы при обычных условиях эксперимента $(T \simeq 3.5\,{
m K},\ x \simeq 0.5,\ L \simeq 1\,{
m cm})$ значение t_2 будет принимать значение порядка $5 \cdot 10^{-3}$ s, что сравнимо по величине с временами распадных процессов.

Таким образом, представлена достаточно простая теоретическая модель, содержащая два основных параметра — отношение теплоемкости всей системы к фононной теплоемкости C и отношение времени диффузионного распространения фононов к времени релаксации ДУС k_0 . Этих двух параметров оказалось достаточно, чтобы описать основные аномалии в температурной и концентрационной зависимости процессов распространения слабонеравновесных фононов в системах, содержащих центры захвата. Дальнейшее уточнение модели (учет спектрального состава инжектируемых фононов, включение в рассмотрение нескольких подсистем ДУС, выход за пределы линейного приближения) позволит описать и более тонкие эффекты, наблюдаемые в экспериментах.

Автор выражает признательность С.Н. Иванову за плодотворные дискуссии и ценные замечания, а также Е.Н. Хазанову за предоставленную возможность ознакомиться с неопубликованными экспериментальными результатами.

Список литературы

- [1] С.Н. Иванов, Е.Н. Хазанов, А.В. Таранов. Письма в ЖЭТФ **40**, *I*, 20 (1984).
- [2] С.Н. Иванов, Е.Н. Хазанов. ЖЭТФ 88, 1, 294 (1985).
- [3] С.Н. Иванов, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов. ЖЭТФ 99, 4, 1311 (1991).

- [4] С.Н. Иванов, А.Г. Козорезов, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов. ЖЭТФ 100, 5, 1591 (1991).
- [5] И.Б. Левинсон. ЖЭТФ 79, 4, 1394 (1980).
- [6] А.Г. Козорезов. ЖЭТФ 100, 5, 1577 (1991).
- [7] В.И. Козуб, А.М. Рудин. ФТТ 38, 2, 352 (1996).
- [8] Cz. Jasinkiewicz, P. Paszkievicz. Z. fur Phys. **B77**, 209 (1989).
- [9] С.Е. Куменков, В.И. Перель. ЖЭТФ 94, 1, 346 (1988).
- [10] С.Н. Иванов, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов, В.А. Ацаркин, В.В. Демидов. ЖЭТФ 94, 5, 274 (1989).
- [11] С.А. Альтшулер, Б.М. Козырев. Электронный парамагнитный резонанс. Наука, М. (1972). 672 с.
- [12] С.Р. Арутюнян, Х.С. Багдасаров, А.П. Додокин, А.М. Кеворков. ФТТ **27**, *8*, 2299 (1985).
- [13] E.P. Steigmeier. Appl. Phys. Lett. 3, 2, 6 (1983).
- [14] О.В. Карбань, С.Н. Иванов, Е.И. Саламатов, С.Г. Быстров. Неорганические материалы **37**, *I*, 1 (2001).
- [15] С.Н. Иванов, А.Г. Козорезов, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов. ЖЭТФ **102**, *2*, 600 (1992).
- [16] Б.А. Данильченко, С.Н. Иванов, Д.В. Поплавский, А.В. Таранов, Е.Н. Хазанов. ЖЭТФ **112**, *I*, 325 (1997).
- [17] У.В. Валиев, Л.Л. Горбунова, М.М. Турганов, Б. Нексвил, Д. Сиранов. ФТТ 37, 4, 1176 (1995).